

СОДЕРЖАНИЕ

Номер 10, 2019

Расширение измерительных возможностей профилометра модели 130 <i>А. Д. Ахсаханян, Н. Н. Салащенко</i>	3
Исследование характеристик нейтронного пучка первого канала реактора ИБР-2 <i>В. Л. Кузнецов, Е. В. Кузнецова, П. В. Седышев, А. П. Сиротин</i>	9
Дизайн монокристалльного дифрактометра для реактора ПИК <i>А. А. Быков, О. П. Смирнов</i>	13
Модель фрактальной частицы гидратированного диоксида циркония на основе данных малоуглового рассеяния нейтронов <i>Л. А. Азарова, Г. П. Копица, Е. Г. Яшина, В. М. Гарамус, С. В. Григорьев</i>	23
Определение параметров ангармонического межатомного потенциала для наночастиц Pt—Fe в полимерной матрице на основе кумулянтного анализа EXAFS <i>С. С. Подсухина, А. В. Козинкин, В. Г. Власенко</i>	30
Исследование химических превращений WF_6 на подложке W методом инфракрасной спектроскопии <i>В. В. Душик, Н. В. Рожанский, Р. Х. Залавутдинов</i>	36
Поляризационные и интерференционные эффекты в резонансной дифракции синхротронного излучения <i>М. М. Борисов, В. Е. Дмитриенко, К. А. Козловская, Э. Х. Мухамеджанов, Е. Н. Овчинникова, А. П. Орешко</i>	42
Экспериментальное наблюдение островковых пленок полярных молекул $C_{60}F_{18}$ на поверхности высокоориентированного пиролитического графита <i>А. В. Горячевский, Л. П. Суханов, А. М. Лебедев, К. А. Меньшиков, Н. Ю. Свечников, Р. Г. Чумаков, В. Г. Станкевич</i>	52
Диагностика элементного состава пленок ЦТС на платине методом рентгеноспектрального микроанализа <i>В. Г. Бешенков, А. Г. Знаменский, В. А. Марченко, А. Н. Некрасов</i>	60
Особенности строения сверхгладкой поверхности (0001) монокристаллов $LaMgAl_{11}O_{19}$ со структурой магнетоплюмбита <i>А. В. Буташии, А. Э. Муслимов, В. А. Федоров, А. Ш. Асваров, А. М. Исмаилов, В. М. Каневский</i>	65
Электрофизические свойства поликристаллических пленок $CuIn_{0.95}Ga_{0.05}Se_2$ <i>Т. М. Гаджиев, М. А. Алиев, А. Ш. Асваров, Г. А. Алиев, А. Э. Муслимов, В. М. Каневский</i>	69
Пористые пленки анодного оксида алюминия на поверхности монокристаллов Al(111) <i>И. В. Росляков, Д. С. Кошковаев, В. А. Лебедев, К. С. Напольский</i>	74
Электронно-микроскопические исследования влияния отжига на тонкие пленки Ge—Sb—Te, полученные методом вакуумно-термического испарения <i>Ю. С. Зыбина, Н. И. Боргардт, П. И. Лазаренко, В. С. Парсегова, А. С. Приходько, А. А. Шерченков</i>	82
Атомно-силовая микроскопия графеноподобных пленок, полученных на предварительно облученном электронами SiO_2/Si <i>Д. М. Седловец, М. А. Князев, О. В. Трофимов</i>	88
Особенности формирования изображений в РЭМ в режиме вторичных медленных электронов. 2. Структуры с трапециевидным профилем и малыми углами наклона боковых стенок <i>Ю. А. Новиков</i>	94
Наноразмерные поверхностные слои титанового сплава, сформированные ионно-лучевым перемешиванием углерода с подложкой <i>В. Л. Воробьев, Ф. З. Гильмутдинов, П. В. Быков, В. Я. Баянкин, И. Г. Поспелова, И. Т. Русских</i>	102
Поляризация дифракционного излучения на проводящей сфере и полусферическом выступе в проводящей плоскости <i>В. В. Сыщенко, Э. А. Ларикова</i>	108